AREC･Ｆｉｉプラザ 第 164 回リレー講演会

品質管理・生産管理分野

■日時：平成 27 年２月 19 日（木） １５：00～１８：００
※終了後（18:00～）名刺交換会開催

■会場：信州大学繊維学部内 AREC（上田市産学官連携施設４階）

講演１ *15:00～16:00*

講師: ラーチマネージメントリサーチ　代表　長野高専客員教授　村岡　正一　氏

【演題】「高付加価値経営を実現する戦略的品質改革手法について」

【概要】製造業において高付加価値経営を実現するためには、製品・技術イノベーションだけでなく
プロセスイノベーションが必須です。それを実現するためには TQC に代表される品質管理手法が有効と
されてきましたが、近年の経済情勢の中、従来のやり方では成果に結び付けるのが難しくなってきています。
仮に品質を向上させても顧客に不満を感じさせたり利益を減らす事になったら本末転倒です。
本講演では品質だけでなくニーズ喚起につながる新しい経営・品質革新手法を紹介し併せて
実施事例を紹介します。

講演２ *16:00～17:00*

講師:双信電機株式会社　EMC 統括部　EMC 技術　部長　渡辺　英司　氏

【演題】「海外での製品拡販と生産性改善」

【概要】1938 年に創業以来、当社はこれまでマイカコンデンサを始め、フィルムコンデンサやＥＭＩフィルタ、
積層誘電体フィルタ、高周波部品、厚膜印刷基板など独自の技術による特徴ある電子部品をお客様に
提供し続け、昨年 12 月に創立 75 周年を迎えました。
1989 年にマレーシア工場を設立。その後、香港や中国でも営業活動を行いながら、LC 回路フィルタ中心に
海外生産を行って参りました。特にＥＭＣ事業に於いては、海外でも電磁波ノイズを測定、診断を行い、
対策用のＥMI フィルタの設計、製造を行いながら、お客様の求められる高信頼性へ対応致しております。
今回はその改善事例について御紹介させて頂きます。

休 憩

講演３ *17:00～18:00*

講師: 松本大学　総合経営学部　総合経営学科　教授　田中　正敏　氏

【演題】「学際的視点からみた品質管理について」

【概要】部品の外形やサービスの応答時間などのような１つだけの工程パラメータのばらつきが、
あらゆる品質問題の根源である。そこで、ばらつきの起源を同定したり、その問題を削除したりすることは、
品質改善の目的において最優先課題である。しかしながら、いつも、ばらつきを削除できるとは限らない。
特に、人や人の流れを扱うとき、我々の管理を超えるばらつきを受け入れなければならない。
ばらつきの源が管理下であっても、それを削除することが返って費用を被る結果となりかねない。
以上のような問題を管理するのが品質管理である。
今回の内容は、この品質管理における問題意識を次の２つに絞る。
１つは「ばらつきの概念」、もう１つは「ロバストな設計」について述べる。

主催：ＡＲＥＣ・Ｆｉｉプラザ／一般財団法人浅間ﾘｻｰﾁｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ　共催：公益財団法人長野県ﾃｸﾉ財団 浅間ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ地域ｾﾝﾀｰ

●お申し込み先　ＡＲＥＣ･Ｆｉｉプラザ事務局 宛
電話（0268-21-4377）　メール（mousikomi@arecplaza.jp）　FAX（0268-21-4382）
下記を FAX またはメールでお送りください

ＡＲＥＣ･Ｆｉｉプラザ 第 164 回リレー講演会 参加申込書			（平成 27 年２月 19 日）
企業・機関名			
参加者名			
所属・役職		電話番号	
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ		ﾌｧｯｸｽ番号	

※ご記入いただいた個人情報（御社名、所属・役職、氏名）は受付名簿としてのみ使用し、他の用途には一切利用いたしません